# Estatística Básica e Introdução ao R

Profa. Dra. Natalia Giordani



## 4.3 Regressão Logística

- Tipo de variável resposta
  - Binária (duas possíveis repostas: sim/não; sucesso/falha)
- Objetivo
  - Modelar a resposta esperada, nesse caso uma probabilidade, como função das variáveis explicativas
- Exemplos de aplicação
  - Avaliação de fatores associados ao cancelamento de plano/desenvolvimento de uma doença
  - Previsão de churn de um cliente /colaborador
  - Análise de crédito (inadimplente)



## 4.3 Regressão Logística

#### Detalhes teóricos

• 
$$logit(p) = log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n$$

$$p = P(Y = 1 | X = x) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n)}}$$

- Parâmetros do modelo obtidos pelo método da máxima verossimilhança
- O que interpretamos: razão de chances  $\exp(\beta)$ 
  - $\exp(\beta) > 1$ : fator de risco, ou seja, aumenta a chance do evento ocorrer
  - $\exp(\beta) < 1$ : fator de proteção, ou seja, reduz a chance do evento ocorrer
  - $\exp(\beta) = 1$ : não afeta a chance do evento ocorrer

### 4.3 Regressão Logística

- Avaliação do ajuste do modelo
  - 1. Estatística da medida geral de ajuste do modelo Teste de Hosmer & Lemeshow
    - H<sub>0</sub>: o modelo tem um bom ajuste aos dados
  - 2. Avaliação das medidas de influência
    - Distância de Cook
  - 3. Avaliação dos resíduos
    - Resíduos de Pearson
      - Diferença entre os valores observados e os preditos sobre o desvio padrão dos valores preditos
    - Resíduos da Deviance
      - Diferença entre os valores observados e os preditos considerando o log-verossimilhança do modelo



## Vamos praticar!

- Objetivo: identificar fatores de risco para baixo peso da criança
  - Dados: birthwt
- Conceitos a desenvolver/discutir
  - Ajuste modelo
  - Avaliação ajuste
  - Interpretação



### Referências

 Morretin, PA; Singer JDM. Estatística e Ciência de Dados. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2022.

Hosmer, DW; Lemeshow, S. Applied Logistic Regression. New York: John Wiley & sons, 2000.

